

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
748-1

1984

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2

1993-08

Amendement 2

Dispositifs à semiconducteurs
Circuits intégrés

Partie 1:
Généralités

Amendment 2

Semiconductor devices
Integrated circuits

Part 1:
General

IEC 60748-1 am2 Ed. 1.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varemé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs, et par le sous-comité 47A: Circuits intégrés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapports de vote
47(BC)1220	47(BC)1323
47(BC)1236	47(BC)1328
47A(BC)260	47A(BC)270

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Chapitre IV: Terminologie, généralités

Ajouter les titres des nouveaux articles suivants:

- 4 Concepts technologiques
- 5 Concepts relatifs aux types particuliers de circuits intégrés à couches et circuits intégrés hybrides à couches

Page 14

Chapitre IV: Terminologie, généralités

Remplacer, à la page 16, le texte existant du paragraphe 1.5 par ce qui suit:

1.5 Microélectronique

Domaine de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortement miniaturisés et de leur utilisation.

Remplacer le paragraphe 1.7 par ce qui suit:

1.7 Caractéristiques de verrouillage des circuits intégrés

NOTE - Les symboles littéraux donnés dans les titres sont uniquement des exemples. Ils montrent que le symbole littéral pour une caractéristique de verrouillage particulière est obtenu en ajoutant un indice supplémentaire normalisé à l'indice du symbole littéral pour la tension particulière ou le courant particulier.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices, and by sub-committee 47A: Integrated circuits.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Reports on voting
47(CO)1220	47(CO)1323
47(CO)1236	47(CO)1328
47A(CO)260	47A(CO)270

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the reports on voting indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Chapter IV: Terminology, general

Add the titles of the following new clauses:

- 4 Technological concepts
- 5 Concepts for particular device types of film integrated circuits and hybrid film integrated circuits

Page 15

Chapter IV: Terminology, general

Replace, on page 17, the existing text of subclause 1.5 by the following:

1.5 *Microelectronics*

That field of science and engineering that deals with highly miniaturized electronic circuits and their use.

Replace subclause 1.7 by the following:

1.7 *Latch-up characteristics of integrated circuits*

NOTE - The letter symbols given in the titles are examples only. They show how the letter symbol for a particular latch-up characteristic is composed by adding a standardized additional subscript to the subscript in the letter symbol for the particular voltage or current.

1.7.1 *Etat de verrouillage*

Etat réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance, et résultant du déclenchement d'une structure bipolaire à quatre couches consécutif au courant résultant d'une surtension à l'entrée, à la sortie ou sur l'alimentation.

1.7.2 *Phénomène de verrouillage*

Processus qui résulte en un état de verrouillage.

1.7.3 *Courant (d'alimentation) à l'état de verrouillage ($I_{CC(L)}$, $I_{DD(L)}$)*

Courant circulant par une borne d'alimentation spécifiée d'un circuit intégré lorsque ce circuit est en état de verrouillage.

1.7.4 *Courant de maintien à l'état de verrouillage ($I_{CC(L)min}$, $I_{DD(L)min}$)*

Courant (d'alimentation) à l'état de verrouillage minimal nécessaire pour maintenir un circuit intégré en état de verrouillage.

1.7.5 *Tension (d'alimentation) à l'état de verrouillage ($V_{CC(L)}$, $V_{DD(L)}$)*

Tension d'alimentation entre les bornes correspondantes du dispositif à un courant d'alimentation spécifié lorsque le circuit intégré est en état de verrouillage.

1.7.6 *Courant de verrouillage (I_{Xlatch} , I_{latch})*

Courant le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne déterminée d'un circuit intégré qui entraîne le phénomène de verrouillage.

1.7.7 *Tension de verrouillage (V_{Xlatch} , V_{latch})*

Tension la plus faible d'une durée spécifiée qui, appliquée entre deux bornes déterminées d'un circuit intégré, entraîne le phénomène de verrouillage.

1.7.8 *Courant d'alimentation de verrouillage ($I_{CClatch}$, $I_{DDlatch}$)*

Courant le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne d'alimentation déterminée d'un circuit intégré qui entraîne le phénomène de verrouillage.

1.7.9 *Tension d'alimentation de verrouillage ($V_{CClatch}$, $V_{DDlatch}$)*

Valeur la plus faible d'une tension d'alimentation d'une durée spécifiée appliquée aux bornes correspondantes d'un circuit intégré qui entraîne le phénomène de verrouillage.

Remplacer, le texte existant du paragraphe 2.2 par ce qui suit:

2.2 *Microstructure*

Dispositif microélectronique qui a une forte densité d'éléments de circuit et/ou de composants et qui est considéré comme une seule unité.